

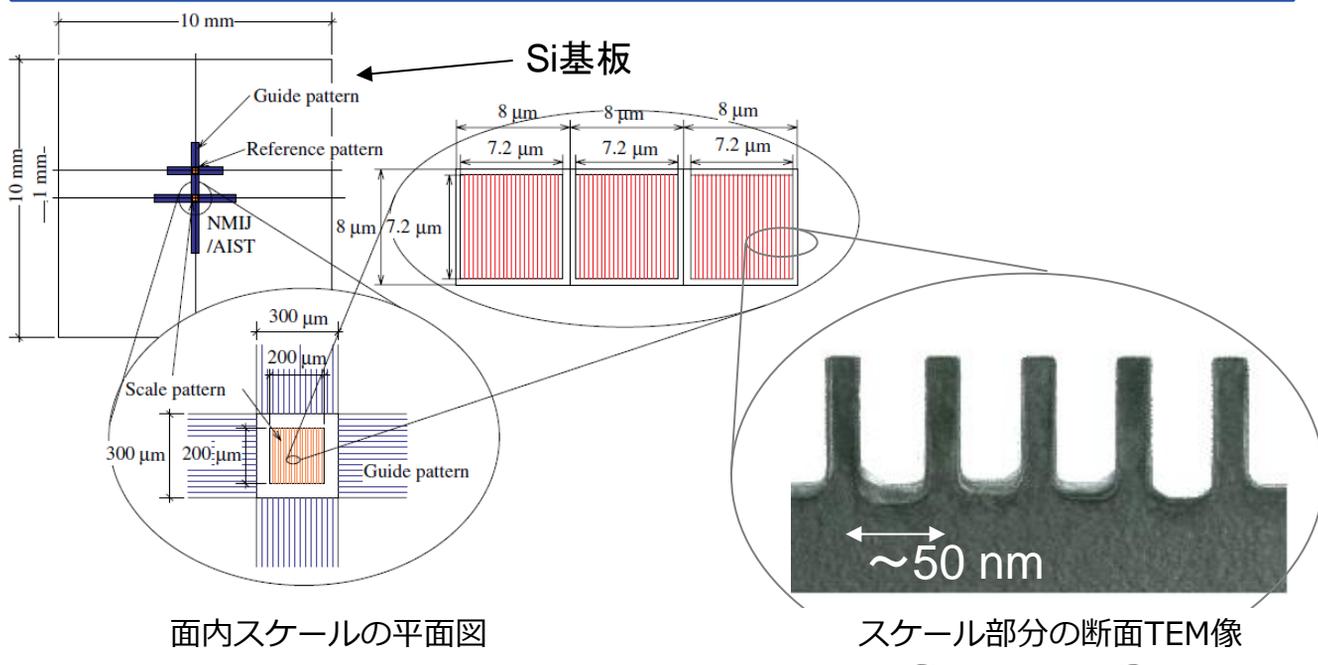
お手持ちのAFM, SEMによる nmオーダーの正確な長さ測定を実現

A F M , S E M 長 さ ス ケ ー ル

50 nm面内スケール

従来、数10 nmレベルで校正された標準物質が存在しなかったため、AFM, SEMで正確な長さの測定は不可能でした。

世界で初めて、校正された50 nmピッチの面内スケールをお届けします。



製品は、作成後、計量標準総合センター(NMIJ)において校正し、納品いたします。
 納品までの流れ；

ご注文→作製(NTT-AT)→校正代理申請(NTT-AT)→校正(NMIJ)→納品

本製品は産業技術総合研究所で開発されたものです*。

* : I. Misumi, et. al. Meas. Sci. Technol., 17 (2006) 2041-2047.

*本カタログ記載の内容は予告なく変更することがあります。

PS201412Z

お問い合わせ先

Tel : 046-270-2075 E-mail: analysis@ml.ntt-at.co.jp
<http://www.keytech.ntt-at.co.jp/>

NTTアドバンステクノロジー株式会社

グローバル事業本部 営業部門
 〒243-0124 神奈川県厚木市森の里若宮3-1